

《 ひびきのテスト研究会 第8回会合アジェンダ (敬称略) 》

- 日時:2025年12月24日 (水) 13:00~17:20
- 会場:学研都市 産学連携センター 2F 研修室 & オンライン(ハイブリッド)
- テーマ分野: IC系 :3次元デバイスや異種チップ接合に関する設計・テスト技術
パワーデバイス:新デバイスやパッケージの信頼性評価技術

1. 挨拶 (公財)北九州産業学術推進機構 半導体産業支援センター長 :13:00~13:05
一徳 仁
2. 事務局 事務局連絡事項 (公財)北九州産業学術推進機構 産学連携担当部長 :13:05~13:15
原田 英次

3. 半導体テスト研究テーマ議論 (会場説明、各テーマ45分:発表40分、議論:5分)
- 第1テーマ「1(ナノ)3(D)時代におけるテスト設計の課題」 :13:20~14:05
発表者: 九州工業大学 情報工学研究院 情報・通信工学研究係 高信頼知的集約センター 教授 温 暁青
 - 第2テーマ「深層強化学習に基づいたテスト容易化設計」 :14:10~14:55
発表者: 愛媛大学 大学院理工学研究科 情報工学講 計算機システム研究室 講師 王 森岭
 - 第3テーマ「電子機器の熱マネジメント」 :15:00~15:45
発表者: 北九州市立大学 国際環境工学部 学部長 教授 井上 浩一

< 休憩 :10分 >

4. 企業情報テーマ
- 第1テーマ (説明:20分、質疑応答:5分)
テーマ 「チップレットで設計フローが変わる、解析と設計環境も協調がキーに」 :16:55~16:20
発表者: 株式会社 図研 本社 中央研究所 技術本部 シニアパートナー 松澤 浩彦
 - 第2テーマ (説明:10分、質疑応答:5分)
テーマ 「EVA100スタートアップテキストについて」 :16:25~16:40
発表者: アドバンテスト九州システムズ株式会社 管理部 担当部長 戸泉 克基

< 休憩 :10分 >

5. 名刺交換会 :16:50~17:20